

# 金属材料評価センター











## 最新装置を拡充し、金属材料のさまざまな評価を可能に!

付加価値の高いものづくりを実現するためには、用いる材料に関する各種特性の把握と活用が不可欠です。 当センターでは、従来から保有する基本的な金属材料評価装置類の他、電界放出形電子プローブマイクロ アナライザ (FE-EPMA) や反射菊池線回折装置 (EBSD) などの最新の評価装置を活用し、新製品の開発や 製品トラブル原因の究明などを経験豊富な研究員が強力にサポートします。

## さまざまな材料評価で皆様のものづくりを強力にサポートします!

この他にも様々な機器を設置しています。詳細につきましては、お問い合わせください。

古くからものづくりの材料とされてきた金属材料は、他の材料に はない優れた特性を有しているため、現代社会においてもなお、 主要な材料として位置づけられています。また、今日では、ものづく りのために特別に造り込まれた金属材料を用いることも珍しくあり ません。したがって、ユーザーのニーズを的確に捉えた付加価値の 高いものづくりを実現するためには、高度な加工・組み立て技術だ けでなく、用いる材料の特性や状態の的確な把握と活用が重要と なっています。

大阪産業技術研究所では、従来から保有する基本的な金属材料 評価装置類に加えて最新の機器を拡充し、様々な材料評価でもの づくりをサポートする「金属材料評価センター」を設置しました。

本センターでは、専門知識を有する経験豊富な研究員が各種の 金属材料評価装置を活用し、皆様のものづくりを強力にサポート します。また、いくつかの機器については、皆様ご自身で試験・分析 等を実施することができる体制を整えました。

#### 主な評価目的

- 材料主要成分、あるいは微量成分に関する定性、定量分析
- ■材料の結晶構造同定
- 材料微細組織の観察・同定
- ■材料、あるいは製品の残留応力測定
- ■材料の硬さの評価
- ■材料、あるいは製品の強度などの評価

この他にも様々な目的で金属材料に関する評価・解析を行うこと ができます。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。

#### ご利用料金について

■別紙のご利用料金表をご参照ください。



#### スパーク放電発光分光分析装置



- ■主な使用目的
- 材料の主要成分の定量分析
- ■主な仕様
- 島津製作所製 PDA-7000
- 試料条件:
- φ14 mm以上のフラット面

#### ICP発光分光分析装置



■主な使用目的 材料の特殊成分の定量分析

- ■主な仕様
- ◆ SIIナ/テク/ロジ-製 SPS3520UV
- ◆ サーモフィッシャーサイエンティフィック製 iCAP6300
- 固体試料量:数 g~
- ●溶液試料濃度:数 ppm~

#### 走杳電子顕微鏡



- 主な使用日的
- 材料微細組織観察 ● 破断面観察
- ■主な仕様
- 日本電子製 JSM6610
- 2次電子像分解能: 3 nm (30 kV) \ 8 nm (3 kV)
- 試料サイズ:
- $\sim \varphi 200 \text{ mm} \times 80 \text{ mm(H)}$
- ステージ稼動範囲: 125 mm(X), 100 mm(Y)

#### X線応力測定装置



#### ■主な使用目的

材料、あるいは製品の表面 近傍の非破壊残留応力測定、 残留オーステナイト測定

#### ■主な仕様

リガク製 AutoMATE

- 最大出力:2 kW
- 照射X線径:
- $\varphi$  0.15 mm $\sim \varphi$  4mm
- 試料サイズ:  $\sim \omega$  320 mm  $\times$  215 mm(H),

#### 炭素•硫黄分析装置



- ■主な使用目的
  - 材料中の炭素、硫黄の 定量分析
- ■主な仕様 LECO製 CS844
- 固体試料量:数 g~

#### 波長分散型蛍光X線分析装置



- 主な使用目的 材料の主要成分の定性分析

- リガク製 ZSX PrimusIV
- 対象元素範囲:9F~92U
- 試料サイズ: 最大 $\varphi$ 40 mm $\times$ 30 mm(H)
- 分析径:

### $\varphi$ 0.5 mm $\sim \varphi$ 30 mm

#### 電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)



- ■主な使用目的
- 局所定性•定量分析

#### ■主な仕様

- 日本電子製 JXA-8530F
- 分析元素範囲:4Be~92U
- 最小プローブ径:
- 40 nm (10 kV, 0.01  $\mu$  A) ■ 試料サイズ:
- $\sim$ 100 mm $\times$ 100 mm $\times$ 50 mm(H)

#### 原子吸光分析装置(フレーム/ファーネス)



- ■主な使用目的
- 材料の微量成分の定量分析
- ■主な仕様
- アナリティクイエナ製 ZEEnit700P
- 固体試料量:数 g~
- 溶液試料濃度:
- ・数 ppm~(フレーム)
- 数 ppb~ (ファーネス)

#### X線回折装置



- 主な使用目的 材料結晶構造の同定
- ■主な仕様
  - リガク製 SmartLab
  - 最大出力:9 kW

  - X線プローブ最小径:400 µm
  - ●広角測定、薄膜測定、小角散乱、 微小部測定が可能

#### 反射菊池線回折装置(EBSD)



- 微細組織結晶方位分布の同定
- ■主な仕様 TSL製 OIM7.1
- ●空間分解能:100 nm以下
- 測定時間: 0.01 sec/point
- 分析範囲: φ20 mm
- ●高精度ひずみ解析ソフト付

#### マイクロビッカース硬さ試験機



- ■主な使用目的 材料の局所硬さ評価
- 主な仕様
- ミツトヨ製 HM-220D
- 試験力:0.490 mN~19.61 N
- 試験体サイズ:
- ・奥行き~160 mm · 高さ~72 mm
- ・質量~3 kg
- ●くぼみ対角線長さ自動測定可能

#### 材料試験機



- ■主な使用目的 材料、あるいは製品の強度評価
- ■主な仕様
- 島津製作所製 UH-500KNI
- 最大試験力:500 kN

ひずみ速度

- 試験速度制御: 変位速度、荷重速度、
- 引張、圧縮、曲げ、せん断

## まずはお電話かウェブサイトでご相談ください

和泉センター 総合受付 電話 0725-51-2525

**https://orist.jp/** (大阪技術研ホームページ) トップページ**→**利用案内**→**和泉センター**→**技術相談

#### ご利用までの流れ





依頼試験

装置使用

受託研究

共同研究

#### 注意事項

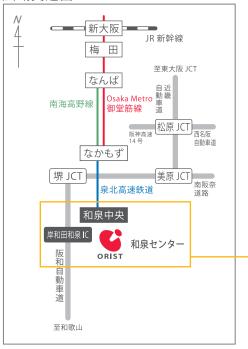
- ■まずは、お電話かウェブサイトでご相談ください。
- 装置のご利用は、事前予約の上、来所して下さい。
- 依頼試験・装置使用の料金は、料金表をご参照ください。
- 受託研究の料金は、お打ち合わせの上、決定します。

#### 【はじめて研究所を利用される方へ】

研究所のご利用には、利用者登録が必要です。 手続きの詳細は、和泉センター 総合受付に お問い合わせください。

#### 和泉センターへの交通アクセス

広域交通図



付近図



- お車をご利用の方 阪和自動車道「岸和田和泉 IC」すぐ
- 電車・バスをご利用の方 泉北高速鉄道「和泉中央駅」から 南海バス(5番のりば)に乗車 「大阪技術研前」まで約10分

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目7番1号

電 話 0725-51-2525 (総合受付) ※ 受付時間 平日 9:00 ~ 12:15 F A X 0725-51-2509 13:00 ~ 17:30

U R L https://orist.jp/





## **公** 金属材料評価センター ご利用料金表

2019年10月1日現在

### 依 頼 試 験

スパーク放電発光分光分析						
A303	1試料 5成分	¥8,000	1 成分増すごとに¥660			
炭素、硫黄定量分析						
A320	1試料 1成分	¥5,100	1成分増すごとに¥5,100			
ICP発光分光分析(定量)						
A316	1試料 1成分	¥8,100	1成分増すごとに¥8,100			
波長分散蛍光X線分析(元素指定)						
A304	1試料 1成分	¥6,300	1成分増すごとに¥2,600			
波長分散蛍光X線分析(全定性)F~U						
A305	1 試料	¥13,000				
X線回折(測定)						
A310	1 測定	¥6,700				
X線回折()	定性)					
A311	1 測定	¥12,700				
金属組織写	<b>写真撮影</b>					
G415	1試料 1枚	¥5,200	1枚増すごとに¥2,200			
走査電子顕	<b>[微鏡写真撮影</b>					
G403	1試験 1枚 1項目	¥26,600	1項目増すごとに¥3,400			
電界放出形電子プローブマイクロアナリシス						
G421	1試料 1項目	¥33,600	1項目(測定)増すごとに¥4,100			
	CRACIL CASE	T33,000	1項目(条件)増すごとに¥2,100			
X線残留応力測定						
G204	1 測定	¥10,500				
X線残留応力測定(特殊)						
G205	1 測定	¥16,200				
ロックウェ	ル硬さ試験					
G305	1 試験	¥3,100				
G306	1試験 10箇所(分布)	¥4,300	10箇所増すごとに¥4,300			
ビッカース硬さ試験(9.807 N以下)						
G312	1 試験	¥4,300				
G313	1試験 10箇所(分布)	¥7,500	10箇所増すごとに¥7,500			
ブリネル硬さ試験						
G307	1 試験	¥3,000				
引張(一般)						
G101	1 試料	¥4,400				
	この他にもご利用い	ただける依頼試験が	でざいます。詳細につきましては、ご相談ください。			



## 金属材料評価センター ご利用料金表

2019年10月1日現在

## 装 置 使 用

倒立型金属顕微鏡撮影システム	A7210	¥2,100	1時間当たり
走査電子顕微鏡		¥12,600	半日当たり
電界放出形電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	A9246	¥46,400	半日当たり
モデルス国がモリント・フィントン・フィン(「ここ)	A9247	¥77,600	1日当たり
	A9246	¥46,400	半日当たり
反射菊池線回折装置(EBSD)	A9247	¥77,600	1日当たり
	A9249	¥1,500	データ解析1時間当たり
X線応力測定装置	A7214	¥5,500	1時間当たり
X線応力測定装置(高出力)	A7215	¥6,000	1時間当たり
ロックウェル硬さ試験機	A9225	¥2,200	1時間当たり
マイクロビッカース硬さ試験機	A7304	¥3,500	1時間当たり
ブリネル硬さ試験機	A3004	¥2,400	1時間当たり
500 k N油圧材料試験機	A7212	¥4,100	1時間当たり

この他にもご利用いただける装置がございます。詳細につきましては、ご相談ください。







